



№ п/п	Наименование	Год выпуска	Назначение	Технические характеристики	Метрологическое обеспечение	Фото
1	ЯМР-спектрометр AVANCE II 600, Bruker Corporation, Германия	2007	Исследование строения и свойств молекул и молекулярных систем, динамики внутри-межмолекулярных обменных процессов, реакционной способности новых классов органических, элементоорганических соединений и полимеров в растворах.	<p>Напряженность магнитного поля: 14.1 Тесла</p> <p>Рабочая частота на ^1H — 600 МГц.</p> <p>Датчики —</p> <p>ВВ1 широкополосный, инверсный с автоматической настройкой и Z-градиентом; 5 мм</p> <p>Диапазон частот от 109Ag до ^1H</p> <p>Smartprobe с автоматической настройкой и Z-градиентом; 5 мм</p> <p>Диапазон частот от 109Ag до ^1H</p> <p>Диапазон рабочих температур -80 °C - +100°C</p>	<p>-Внутренняя стабилизация рабочей частоты по сигналу дейтерия</p> <p>-Наличие стандартных образцов</p> <p>^1H Sensitivity, 5 mm Ø, 0.1% Ethylbenzene (EB) in Chloroform-d</p> <p>^{13}C Sensitivity 40% Dioxane in Benzene-d6 (ASTM)</p> <p>Регистрация контрольных спектров стандартных образцов — не реже 1 раза в год</p>	
2	ЯМР-спектрометр AVANCE DRX 500, Bruker Corporation, Германия	2002	Исследование строения и свойств молекул и молекулярных систем, динамики внутри-межмолекулярных обменных процессов, реакционной способности новых классов органических, элементоорганических соединений и полимеров в растворах.	<p>Напряженность магнитного поля: 11.7 Тесла</p> <p>Рабочая частота на ^1H — 500 МГц.</p> <p>Датчики —</p> <p>ВВ1 широкополосный, инверсный с Z-градиентом; 5 мм</p> <p>Диапазон частот от 109Ag до ^1H</p> <p>ВВ {^1H} 5мм triple inverse ^1H {^{13}C, ^{31}P-207Ag} with Z-gradient coil</p> <p>ВВ0 широкополосный; 5 мм</p> <p>Диапазон частот от 109Ag до ^1H</p> <p>Диапазон рабочих температур -80 °C - +100°C</p>	<p>Внутренняя стабилизация рабочей частоты по сигналу дейтерия</p> <p>-Наличие стандартных образцов</p> <p>^1H Sensitivity, 5 mm Ø, 0.1% Ethylbenzene (EB) in Chloroform-d</p> <p>^{13}C Sensitivity 40% Dioxane in Benzene-d6 (ASTM)</p> <p>Регистрация контрольных спектров стандартных</p>	

					образцов — не реже 1 раза в год	
3	ЯМР-спектрометр AVANCE III 400 WB, Bruker Corporation, Германия	2012	Исследование строения и свойств молекул и молекулярных систем, динамики внутри-межмолекулярных обменных процессов, реакционной способности новых классов органических, элементоорганических соединений и полимеров в растворах. Спектроскопия ЯМР твердого тела, диффузионные эксперименты, ЯМР томография	<p>Напряженность магнитного поля: 9,4 Тесла</p> <p>Рабочая частота на ^1H — 400 МГц.</p> <p>Датчики —</p> <p>ВВО широкополосный с автоматической настройкой и Z-градиентом; 5 мм Диапазон частот от 109Ag до ^1H</p> <p>CP/MAS BBO $\{^1\text{H}\}$ 4mm</p> <p>CP/MAS BBO $\{^1\text{H}\}$ 2mm</p> <p>MIC 400 W1S2 BBO $\{^1\text{H}\}$ 5mm</p> <p>Диапазон рабочих температур -80 °C - +100°C</p>	<p>образцов — не реже 1 раза в год</p> <p>Внутренняя стабилизация рабочей частоты по сигналу дейтерия</p> <p>-Наличие стандартных образцов</p> <p>^1H Sensitivity, 5 mm Ø, 0.1% Ethylbenzene (EB) in Chloroform-d</p> <p>^{13}C Sensitivity 40% Dioxane in Benzene-d₆ (ASTM)</p> <p>Регистрация контрольных спектров стандартных образцов — не реже 1 раза в год</p>	

4	<p>Масс-спектрометрический времяпролётный комплекс высокого разрешения</p> <p>Maxis и MicroTOF II, Bruker Daltonic, Германия с жидкостным хроматографом Agilent 1200</p>	2009	<p>Анализ и исследование веществ и смесей веществ методом масс-спектрометрии высокого разрешения с использованием ионизации электрораспылением или химической ионизации при атмосферном давлении.</p>	<p>Регистрация масс-спектров с ионизацией электрораспылением или химической ионизацией при атмосферном давлении в диапазоне масс от m/z 50 до 1 000 000 с разрешением до 30 000, tandemная масс-спектрометрия (диссоциация, активируемая соударениями), обращено-фазовая ВЭЖХ-МС</p>	<p>Калибровка прибора с использованием стандартных калибровочных растворов (Agilent technologies), обеспечивающая погрешность измерения массы с точностью до 0.5 ppm</p>	
5	<p>Микроскоп электронный сканирующий SU-8000, Hitachi, Япония</p>	2010	<p>Исследование микроструктуры, морфологии и локального состава материалов (в т.ч. наноматериалов)</p>	<p>ускоряющее напряжение 100 В - 30 кВ; макс. увеличение 800000; разрешение 1 нм; разрешение EDX детектора 129 эВ на линии $K\alpha(Mn)$, скорость счета до 100000 имп/с</p>		